

TZ-410 型 LED 自动探针测试台

该机专用于测试各种色系的半划切 LED 芯片，与 LED 测试仪互连后能自动完成对 LED 芯片光参数、电参数测试，具有 MAP 图输出和分类存储等功能。

主要技术特点：

1. 全封闭式结构
2. 平面电机气浮工作台
3. 支持测试仪及设备一体化（预留有集成空间）
4. 承片台光电闭环控制
5. 承片台表面采用镀金工艺
6. 可调式分离针探头测试
7. 采用嵌入式专用工控机，集成专用运动控制器，15 LCD 显示器
8. I/O 系统配备了光电隔离转接盒，提高了抗干扰能力，具有自我保护功能
9. 具有集成网卡，支持设备联网
10. Windows 友好界面，动态显示测试过程
11. 同步/延时/离线打点
12. 手动/自动测试任选
13. 自动测试方式灵活多样（单点、矩阵、探边、圆形、圆环、自定义编辑、抽测）
14. 具有测试坐标输出、记忆功能
15. 具有信息提示和自动报警功能
16. 测试过程中动态绘制 MAP 图，并支持 MAP 电子文档坐标信息输出；
17. 三目体视专用显微镜



主要技术指标：

可测片径：2、3、4
显微镜：14X~19X
工作台行程：290mm × 290mm
工作台速度：150mm/s
步进分辨率：0.001mm
定位精度：±0.010mm
重复精度：±0.003mm
步距范围：0.001-110mm（公制） 0.00039"-4.3307"（英制）
Z 向行程：0~6mm
Z 向重复精度：±0.003mm
Z 向分辨率：0.002 mm



中国电子科技集团公司
第四十五研究所
**CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY
GROUP CORPORATION
NO. 45 RESEARCH INSTITUTE**

地址：北京东燕郊开发区海油大街 20 号
电话：010-61598218 传真：010-61598221
网址：<http://www.45inst.com>
电邮：sales@cetc-45inst.com

向调整范围： $\pm 15^\circ$

延时打点个数：1~7 个

测试仪接口：TTL、RS232

最多可布可调探头数：3 支、打点器 2 支、探边器 1 支

外形尺寸：(长×宽×高) 570mm×550mm×1500mm

重量：约 150 kg

使用温度环境：15 -25

相对湿度：< 70%

电源：AC 220V \pm 22V 50Hz \pm 1Hz

功耗：< 0.5kW

气源：0.4~0.6MPa

真空：0.08MPa (用户自备)